



반도체 전공정의 미세 파티클,
패턴 검사를 위한 솔루션

Linea HS MUV 16k BSI

Pixel size
5 μm

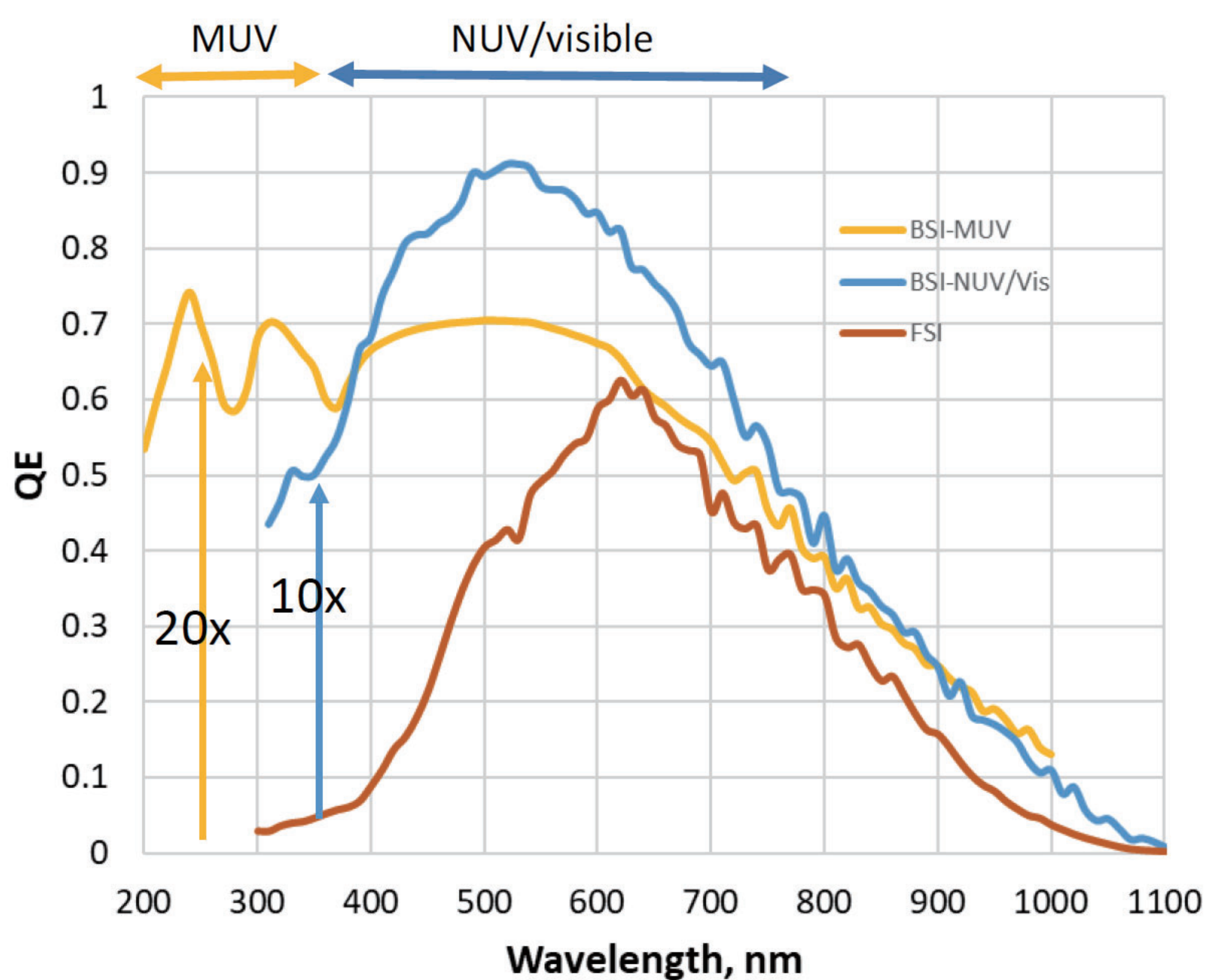
Resolution
16k
(16,384x128)

Line rate
400 kHz

Wavelength
200 nm
~ 1,000 nm

BSI TDI CAMERA

기존 FSI 대비 **10~20배 높은 QE**



- 애플리케이션
반도체 미세 파티클/패턴 검사 등 UV 파장대에 대응

LIGHT SOURCE

고휘도 UV LED 광원 솔루션

- 다양한 파장대별 제품 라인업(출시 예정/커스텀 개발)
235nm / 255nm / 265nm / 275nm / 280nm /
308nm / 310nm / 365nm / 385nm / 405nm

 **REVOX**
Solutions by Photon



- 최대 30,000시간까지 안정적인 밝기를 제공하는
Feedback 기능 추가 가능

